

500u D70 44				OF COUNTROE	I .—	<del></del>			
FORM PT0-1449			U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE		ATTY. DOCKET NO.	SE	RIAL NO.	27	7
					404800	Ń	10/602377 Not assigned		
					APPLICANT	<del></del>		· ·	
LI	ST O	F REFERENCES CITED I	BY APPLICA	NT	Spirox Corporati	on			•
					FILING DATE GROUP				
					June 24, 2003	2138 Not assigned			
	- <del></del>		U. S. PATE	ENT DOCL	JMENTS	<del></del>	<del></del>	<del></del>	
EXAMINER		DOCUMENT NUMBER	DATE	<u> </u>	NAME	CLASS	SUBCLASS	FILING	DATE
. INITIAL				·	•			II APPROI	•
	AA		<del> </del>						<del></del>
<del>;</del>	AB		<del> </del>		<del></del>	<del>.  </del>		<u> </u>	
·	AC	<del></del>			<del> </del>	_	<del> </del>	<del></del>	<del></del>
<del>-</del>	AD	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>	<del> ,</del>		<del></del>
	AE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>		<del> </del>	 	· · · ·
• •	<del></del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		<del></del>	-17	
·	AF		1	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		·	
<del>.</del>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>			· · · · · · ·	
	AH		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	<del> </del>			
<del></del>	Al		<del>   </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del> </del>	,	
<del> </del>	AJ	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
J	AIN		FOREIGN PA	TENT DO	CUMENTS	<u> </u>	<u>!</u>	L,	
·	<del></del>	DOCUMENT NUMBER DATE			. NAME	CLASS	CLASS SUBCLASS TRANSLATION		
								YES	ŇO
<del>-,</del>	AM	7			·	· · ·		<del> </del>	T
	AN			<del></del>					<del>                                     </del>
	AO		<del> </del>	<del></del>	•			<del>-,,</del>	$\vdash$
	AP		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	<u> </u>		-
<del></del>	AQ			<del></del>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
<del></del>		OTHER PRIOR ART (I	NCLUDING AU	THOR, TITL	E, DATE, PERTINENT F	PAGES, ET	C.)	<del> </del>	
(b)	AR	Yeh et. al, "Flash Memo	ory Built-In S	Self Test L	Jsing March-Like Al	gorithms'	,	.—	
35		Mohammad et al., "Testing Flash Memories", (pgs. 406-411), January 2000							
100		Mohammad et al., "Flash Memory Disturbances: Modeling and Test" (pgs. 1- 9)							
· 1		reference considered, whether or r		<del> </del>					